

Division Spectroscopie d'Electrons SFV
Répertoire des Compétences Nationales en Spectroscopies d'Electrons

Région Sud-Est

Ville	Equipe/Laboratoire/Institut	Moyen Propre	Centre Technique Commun	Plateforme d'Institut	Axes thématique Laboratoire	Description des moyens techniques, compétences ou méthodes synchrotron utilisées	Mode d'accès collaboratif	Mode d'accès contractuel	Nom/Prénom correspondant	Adresse mail - téléphone	Lien
ECULLY	LTDS-ECL	x			Tribologie Tribochimie	XPS Versa Probe II (Ulvac-PHI)	x	x	Thierry Le MOGNE	Thierry.le-mogne@ec-lyon.fr	
	Science et Surface		x		Société de services	Spectromètre PHI Quantera SXM avec source monochromatisée Al Ka		x	Jacques Brisson	contact@science-et-surface.fr surface.fbrisson@science-et-surface.fr	www.science-et-surface.fr
	INL			NanoLyon	oxydes- semiconducteurs	XPS/XPD (VSW source Al monochromatisée - connecté batis MBE oxydes et III-V -chambre de préparation)	x	x	Geneviève Grenet, Claude Botella	jeve.grenet@ec-lyon.fr, claudie.botella@ec-lyon.fr	
VILLEURBANNE	MATEIS -INSA			CLYM		Microscopie/spectroscopie des électrons "EELS"		x	Thierry Epicier, Mathieu Bugnet	thierry.epicier@insa-lyon.fr, mathieu.bugnet@insa-lyon.fr	www.clym.fr
	ISA	x			Functionalisation de surface	Thermo Fisher Escalab modifié, monochromateur et source FEG pour AES	x	x	François Bessueille	francois.bessueille@univ-lyon1.fr didier.leonard@univ-lyon1.fr	
	ILM		PLYRA			Analyseur Hémisphérique (CLAM IV - VG microtech) Source rayon X Al/Mg 300 W non monochromatisée source d'électron 20 eV - 5keV, résolution énergie 1 eV source d'ions 0-5 kV porte échantillon 80 K à 550 K			olivier Boisson/ Stephane Pailhes	olivier.boisson@univ-lyon.fr, stephane.pailhes@univ-lyon1.fr	
	IRCELyon		x		Catalyse	spectromètre AXIS ULTRA DLD de KRATOS ANALYTICAL (XPS et UPS)			Mimoun Aouine, Luis Cardenas, Eric Ehret	mimoun.aouine@ircelyon.univ-lyon1.fr luis.cardenas@ircelyon.univ-lyon1.fr eric.ehret@ircelyon.univ-lyon1.fr	
MARSEILLE	CINAM				Mouillage -démouillage	Microscopie électronique à électrons lents			Fabien Cheynis	cheynis@cinam.univ-mrs.fr	http://www.cinam.univ-mrs.fr/cinam/
	IM2NP					Holographie d'électrons de basse énergie			Mathieu Petit	petit@cinam.univ-mrs.fr	
						LEEM			Frédéric Leroy	leroy@cinam.univ-mrs.fr	
						Inverse Photoemission Spectroscopy (IPES)			Luca Giovannelli	luca.giovannelli@imn2p.fr	
									Jean-Marc Themin	jean-marc.themin@imn2p.fr	
	PIIM					Diffraction d'électrons lents (LEED)			Eric Salomon	eric.salomon@univ-amu.fr	
						Spectroscopie de pertes d'énergie à haute résolution			Thierry Angot	thierry.angot@univ-amu.fr	
								Jean-Marc Layet	jean-marc.layet@univ-amu.fr		
FUVEAU	Tescan Analytics	x			Prestataire de service en analyse de surface	XPS, ToF-SIMS				https://www.tescan-analytics.com/fr/about-subsiary	
		x									
		x									
CLERMONT-FERRAND	Université Blaise-Pascal	x			Institut PASCAL UMR 6602 - Groupe MINAMAT-Surface et Interface	Bâti pour XPS, UPS, EELS et EPES. Microscopies Auger et pic-élastique. LEED. Couplage avec dépôts in situ (Sn, Ga, Au...) et passivation de surface par source type GDS ou ECR.		x	Christine Robert-Goumet		http://ip.univ-clermont.fr/index.php/fr/minamat-groupe-de-recherche/surface-et-interface
SAINT-ETIENNE	Ecole des Mines			x	Plateforme "Science des Matériaux et Structures	Spectromètre XPS/Auger Theta Probe ThermoFisher et Chambre de Préparation ScientaOmicron pour essais de rupture	x	x	Vincent Barnier Krzysztof Wolski	barnier@emse.fr krzysztof.wolski@mines-stetienne.fr	https://www.mines-stetienne.fr/recherche/structures-scientifiques/plateformes/
GRENOBLE	CEA-MINATEC, Plate-Forme de Nano-Caractérisation (PFNC)			x	LITEN (CEA-DRT): Nanomatériaux pour les nouvelles technologies de l'énergie et matériaux pour batteries et piles à combustible; PV. LETI (CEA-DRT): Semi-conducteurs (inorganiques, organiques), oxydes & III-nitrides pour la nanoélectronique, l'éclairage, les dispositifs de puissance, les microsystèmes, matériaux 2D (graphène, MoS2, WSe2), polymères et bio-dispositifs. IRIG CEA-DRF): Fonctionnalisation de surface, matériaux avancés pour le PV, semi-conducteurs II-VI, spintronique...	XPS Versa Probe II (Ulvac-PHI)		x	Anass Benayad	anass.benayad@cea.fr	
					XPS-UPS Scienta Omicron MultiProbe haute-résolution pour analyses operando et résolues en temps (ms)		x	Eugénie Martinez	eugenie.martinez@cea.fr		
					Imagerie XPS-UPS spectroscopie hte-résolution (XPEEM, APEEM) NanoESCA (ScientaOmicron)		x	Olivier Renault	olivier.renault@cea.fr		
				Nano-sonde Auger à balayage PHI 700X (Ulvac-PHI)		x	Eric de Vito	eric.devito@cea.fr			
				Utilisation régulière du rayonnement synchrotron: HAXPES (SOLEIL-GALAXIES, ESRF-BM25, Spring8-BL15XU, DESY-P09), PES (SOLEIL-TEMPO, ELETTRA-CIPO), XPEEM (ELETTRA-NanoESCA)			Olivier Renault				
	LTM UMR CNRS/UGA			x	Matériaux et gravure plasma pour les technologies de la micro-électronique	XPS Theta Probe ThermoFisher avec valise Adixon pour le transfert des plaques de silicium, connecté au cluster IMPACT	x	x	Bernard Pellissier	bernard.pellissier@cea.fr	
LEPMI, SIMAP (Grenoble-INP)	x	x (CMTC)		SIMAP: Réactivité de surface, physique du métal - LEPMI: physico-chimie des matériaux, électrochimie	Auger Riber (moyen propore), XPS Thermo Kalpha (moyen commun)			Grégory Berthomé (SIMAP) Marian Chatenay (LEPMI)	gregory.berthome@simap.grenoble-inp.fr		
ST Microelectronics (Crolles)	x			Semiconducteurs, dispositifs	XPS PHI Quantera			Marc Juhel	marc.juhel@st.com		
Constellium Technology Center	x			Métaux et alliages				Aurélien Lefrançois			
Institut Néel (CNRS)	x			STM, croissance in-situ	XPS pour contrôle de la croissance in-situ avant STM			J.-Y. Veullen	Jean-Yves.Veullen@neel.cnrs.fr		